

	Halbleiterbauelemente Mechanische und klimatische Prüfverfahren Teil 31: Entflammbarkeit von Bauelementen in Kunststoffgehäusen (Selbstentzündung) (IEC 60749-31:2002 + Corr. 1:2003) Deutsche Fassung EN 60749-31:2003	DIN EN 60749-31
ICS 13.220.40; 31.080.01	Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced) (IEC 60749-31:2002 + Corr. 1:2003); German version EN 60749-31:2003 Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 31: Inflammabilité des dispositifs à encapsulation plastique (cas d'une cause interne d'inflammation) (CEI 60749-31:2002 + Corr. 1:2003); Version allemande EN 60749-31:2003 Die Europäische Norm EN 60749-31:2003 hat den Status einer Deutschen Norm. Beginn der Gültigkeit Die EN 60749-31 wurde am 2002-09-24 angenommen. Daneben dürfen die Festlegungen von Kapitel 4, Abschnitt 1.1, der DIN EN 60749:2002-09 noch bis 2005-10-01 angewendet werden. Nationales Vorwort Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig. Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet. Sie geht auf einen Beschluss des TC 47 zurück, die in IEC 60749 enthaltenen Prüfverfahren in getrennten Teilen zu veröffentlichen. Nach Abschluss der von IEC/TC 47 beschlossenen kompletten Überarbeitung der IEC 60749 und der Aufteilung in jeweils einen Teil der Reihe IEC 60749 je Prüfverfahren wird die Reihe der Normen voraussichtlich aus 36 Teilen bestehen. Die Festlegungen der vorliegenden Norm sind identisch mit denen aus Kapitel 4, Abschnitt 1.1, von IEC 60749:1996 + A1:2000 + A2:2001. Mit dem Corrigendum 1:2003-08 zur IEC-Publikation wurde der Maintenance cycle für IEC 60749-31:2002 von 2012 auf 2007 verkürzt. Dies ist in der nachfolgenden Information berücksichtigt. Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation – bestätigt, – zurückgezogen, – durch eine Folgeausgabe ersetzt oder – geändert.	Teilweiser Ersatz für DIN EN 60749:2002-09 Siehe Beginn der Gültigkeit Fortsetzung Seite 2 und 3 Seiten EN DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

DIN EN 60749-31:2003-12

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60749:2002-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Ergänzung der Festlegungen aus Kapitel 4, Abschnitt 1.1, von DIN EN 60749:2002-09 um Abschnitt 1 „Anwendungsbereich und Zweck“ sowie die Überschriften zu den Abschnitten 2 und 3 und
- b) Überarbeitung der Nummerierung, sodass dieses Prüfverfahren in einer eigenständigen Norm veröffentlicht werden kann.

Frühere Ausgaben

DIN 41794-1:1972-06

DIN IEC 60749:1987-09

DIN EN 60749:2000-02, 2001-09, 2002-09